



Лазерный анализатор размеров наночастиц IG-1000 Plus

Производитель: Shimadzu
Corporation

Модель: IG-1000 Plus

<https://assa-group.ru/ig-1000-plus>

Анализатор размеров наночастиц IG-1000 Plus -- это уникальный инструмент, который позволяет проводить измерения не только в нано, но и в суб-нано диапазоне. Революционный метод измерения, созданный компанией Шимадзу позволяет измерять размеры наночастиц в диапазоне от 0,5 до 200 нм с высокой точностью простым и эффективным способом. Этот метод результативен и при анализе размеров одиночных наночастиц.

- **Высококчувствительный анализ размеров частиц.**
Для анализа используется метод индуцированной решетки (IG), который базируется на новом принципе измерения размеров наночастиц. Этот метод позволяет даже в области одиночных наночастиц получать хорошее соотношение сигнал/шум, благодаря чему возможны стабильные измерения с хорошей воспроизводимостью.
- **Сопротивляемость загрязнению.**
Благодаря использованию метода индуцированной решетки (IG), загрязнения исходного образца не оказывает существенного влияния на результаты измерения. Фильтрация проб для удаления крупных частиц не является обязательной.

- **Высокая воспроизводимость.**

Новый метод измерения (IG) гарантирует высокую воспроизводимость и получение стабильных данных и, следовательно, устраняет недостоверность и неточность при анализе частиц в нано области. Это является особенно важным при анализе частиц размером меньше 10 нм.

- **Современное программное обеспечение WINGIG.**

Программное обеспечение, совместимое с операционными системами Windows, предназначено для управления прибором, обработки и вывода полученных данных.

- **Метод индуцированной решетки.**

На специальным образом расположенные электроды, помещенные в среду с диспергированными частицами, подается переменное напряжение. Вследствие этого создается определенное расположение частиц в жидкости, так называемая индуцированная дифракционная решетка. Если прекратить подачу напряжения, то частицы диффундируют и дифракционная решетка распадается. Сенсоры регистрируют изменение интенсивности света при распаде дифракционной решетки, что позволяет получить данные о распределении частиц по размерам.

Применение:

- Анализ размеров нано частиц

Метод измерений

IG-метод (метод индуцированной решетки)

Диапазон измерений

0.5-200 нм

Время измерения

30 секунд (от начала измерения до получения результата)

Количество анализируемого

250-300 мкл

**жидкого образца
детектор
Источник света**

**Ячейка
Габариты (Ш×Г×В)
Вес**

<https://assa-group.ru/ig-1000-plus>

Фотодиод
Полупроводниковый лазер (785
нм, выходящий сигнал 3 мВт)
Емкостная ячейка
600×400×200 мм
15 кг

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.